DIN 50451-4:2007-02 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Elementspuren in Flüssigkeiten - Teil 4: Bestimmung von 34 Elementen in hochreinem Wasser durch Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 3

2 Normative Verweisungen 3

3 Begriffe 4

4 Einheiten 4

5 Kurzbeschreibung des Verfahrens 4

6 Reagenzien 4

7 Geräte und Reinigung 5

8 Probenahme 5

9 Vorbehandlung der Proben 6

10 Durchführung 6

11 Berechnung und Angabe der Ergebnisse 7

12 Präzision und Richtigkeit des Verfahrens und der Prüfergebnisse 7

13 Prüfbericht 8

Anhang A (informativ) **Ergebnisse der Ringversuche** 9

Literaturhinweise 13

Tabellen

Tabelle A.1 — Präzision und Richtigkeit der an einer mit 20 ng/kg dotierten Wasserprobe nach Probenanreicherung ermittelten Daten 9

Tabelle A.2 — Präzision und Richtigkeit der an einer mit 20 ng/kg dotierten Wasserprobe ermittelten Daten bei Direktmessung ohne Probenanreicherung 11